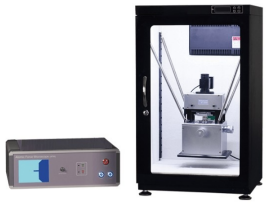
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio de fuerza atomica

Código: B2-01-010668

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La microscopía de fuerza atómica (AFM) es una técnica de imagen de alta resolución para analizar características de superficie a escala nanométrica. Se usa en ciencia de materiales, biología, física y nanotecnología para estudiar superficies y películas delgadas, y permite obtener mapas topográficos a escala atómica.

Características

1. La sonda de barrido y la platina de muestra integradas aumentan la resistencia a interferencias del sistema de suspensión por resortes.
2. Dispositivo láser y de posicionamiento de la sonda para el cambio de sonda y el ajuste del punto láser.
3. La aproximación automática de la muestra a la sonda evita choques del cantiléver.
4. La aproximación vertical de la sonda a la muestra permite posicionarla sobre la zona de interés.
5. La zona de barrido de la muestra se selecciona libremente con una mesa XY de amplio recorrido.
6. El sistema CCD de vista cenital permite observar y posicionar en tiempo real la sonda sobre la región de muestra seleccionada.
7. El sistema de control electrónico tiene diseño modular para mantenimiento y mejoras continuas.
8. El modelo compacto de la familia, distinto de este equipo, se puede transportar dentro de una maleta de aluminio.
9. Este equipo tiene caja hermética, que ofrece un entorno controlado.

Especificaciones técnicas

Especificación	**±6.5mm - Ángulo de barrido 0°~360° - 10±2ms B2-01-010668**
Modos de trabajo	Modo de contacto y modo lapping Modos opcionales: Fase, Fricción(LFM), Magnético(MFM), Electrostático(EFM)
Tamaño de muestra	Φ≤90mm, H≤20mm
Escáneres disponibles	10*10μm, 20*20μm, 50*50μm, 100*100μm
Resolución de barrido	0.2nm en dirección XY, 0.05nm en dirección Z
Rango de movimiento de la muestra	±6.5mm
Ancho de pulso del motor paso a paso	10±2ms
Puntos de muestreo de imagen	512*512
Aumento óptico 4X	Resolución óptica 2.5μm
Velocidad de barrido 0.6Hz~4.34Hz	Ángulo de barrido 0°~360°
Control de barrido	D/A de 18-bit en dirección XY, D/A de 16-bit en dirección Z
Muestreo de datos	A/D de 14-bit, doble A/D de 16-bit con muestreo sincrónico multicanal
Retroalimentación	Retroalimentación digital DSP

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	±6.5mm - Ángulo de barrido 0°~360° - 10±2ms B2-01-010668
Frecuencia de muestreo de la retroalimentación	64kHz
Interfaz con el computador	USB 2.0
Sistema operativo	Windows XP/7/8/10
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz(opcional)
Dimensiones del embalaje	550*550*1150mm
Peso bruto	65kg

Aplicaciones

1. Confirme el tamaño de sus muestras

Compare el diámetro y la altura de sus muestras con lo que admite la platina, y el desplazamiento que necesita para ubicar la zona de interés.

- **Tamaño de muestra**: Φ≤90mm, H≤20mm
- **Rango de movimiento de la muestra**: ±6.5mm

2. Defina el área y la resolución de barrido

Elija el escáner según el tamaño de las estructuras que estudia y revise la resolución lateral y vertical que requiere su análisis.

- **Escáneres disponibles**: 10*10μm, 20*20μm, 50*50μm, 100*100μm
- **Resolución de barrido**: 0.2nm en dirección XY, 0.05nm en dirección Z

3. Revise los modos de trabajo

Confirme si sus ensayos requieren modos adicionales, como fase, fricción, magnético o electrostático.

- **Modos de trabajo**: Modo de contacto y modo lapping Modos opcionales: Fase, Fricción(LFM), Magnético(MFM), Electrostático(EFM)

4. Prevea la instalación

Disponga de un computador con sistema operativo compatible, una toma eléctrica adecuada y espacio para recibir el equipo.

- **Interfaz con el computador**: USB 2.0
- **Sistema operativo**: Windows XP/7/8/10
- **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz(opcional)
- **Dimensiones del embalaje**: 550*550*1150mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización